

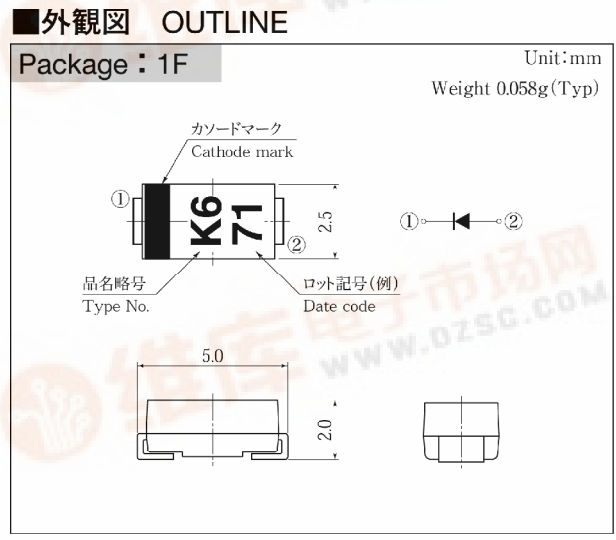
Single Diode

Super Fast Recovery Diode

D1FK60

600V 0.8A

- | | |
|---|--|
| <p>特長</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 小型SMD ● 高耐圧 ● trr=75ns ● 低VF=1.3V | <p>Feature</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Small SMD ● High Voltage ● trr=75ns ● Low VF=1.3V |
| <p>用途</p> <ul style="list-style-type: none"> ● スイッチング電源 ● DC/DC コンバータ ● 家電、OA ● 通信 ● フライホール | <p>Main Use</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Switching Regulator ● DC/DC Converter ● Home Appliance, Office Automation ● Communication ● Fly Wheel |



外形図については新電元Webサイト又は〈ダイオードカタログ・技術資料編〉を参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of the outline dimensions, refer to our web site or the diode technical data book. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$)

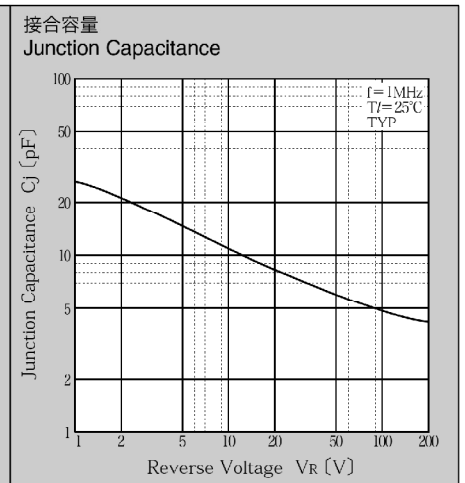
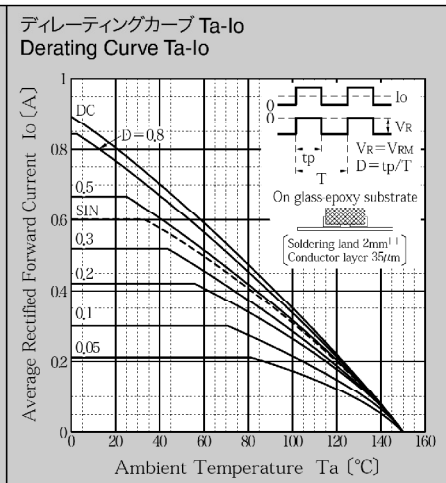
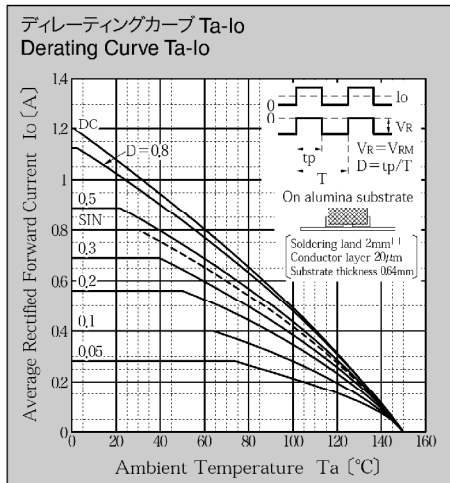
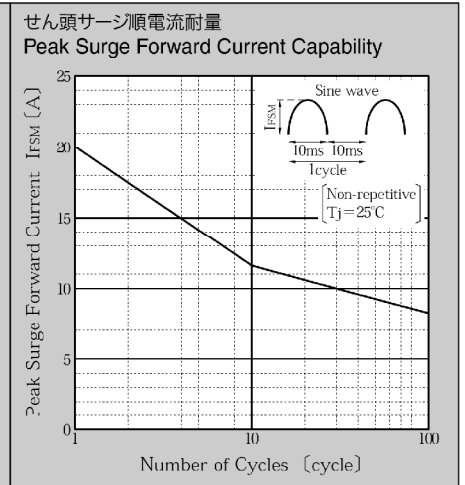
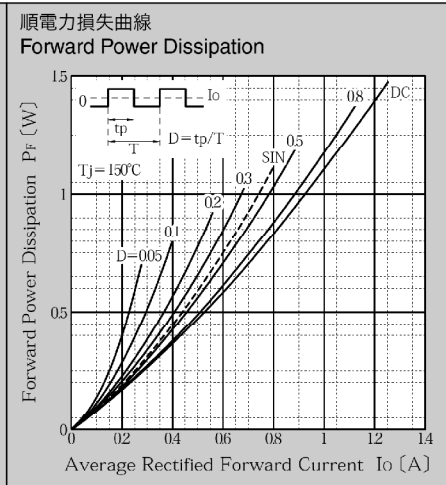
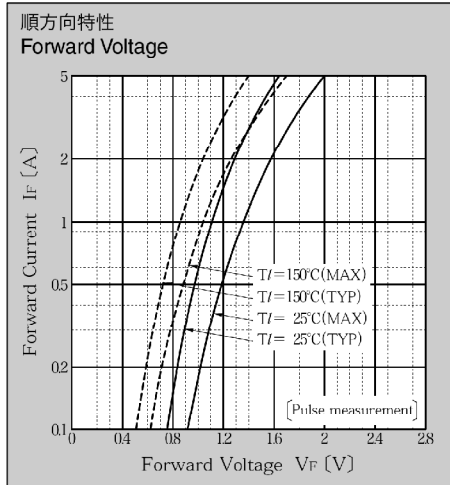
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D1FK60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	T _a = 29°C アルミナ基板実装 On alumina substrate	0.8	A
			T _a = 33°C プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	0.6	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25°C		20	A

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 0.8A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.3	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _F = 0.5A, I _R = 1.0A, 0.25I _R	MAX 75	ns
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V	TYP 11	pF
	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 23	
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	MAX 108	°C/W
		アルミナ基板実装 On alumina substrate	MAX 157	
		プリント基板実装 On glass-epoxy substrate		



■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っており、Typicalは統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.